(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005年6月30日(30.06.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/059571 A1

(51) 国際特許分類7:

G01R 1/06

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/018562

(22) 国際出願日:

2004年12月13日(13.12.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2003-421675

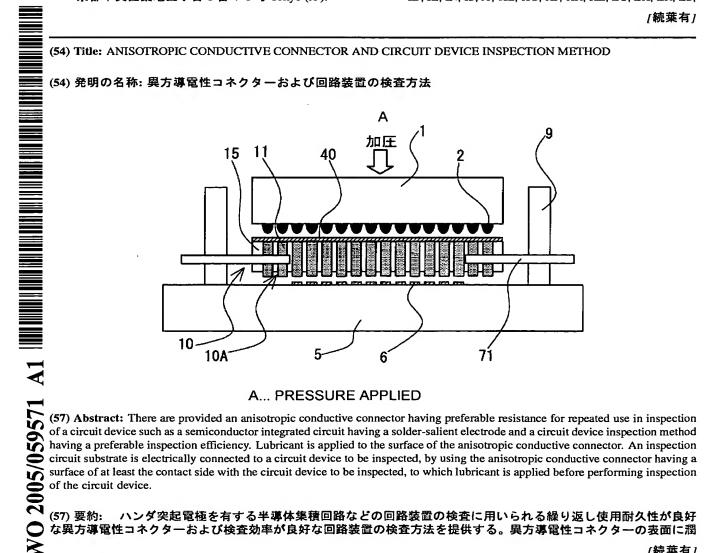
2003年12月18日(18.12.2003)

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): JSR 株式会社 (JSR CORPORATION) [JP/JP]; 〒1040045 東 京都中央区築地五丁目6番10号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 山田 大典 (YA-MADA, Daisuke) [JP/JP]; 〒3501236 埼玉県日高市猿 田289番地1株式会社JSRマイクロテック内 Saitama (JP). 木村 潔 (KIMURA, Kiyoshi) [JP/JP]; 〒 3501236 埼玉県日高市猿田 2 8 9 番地 1 株式会社 JSRマイクロテック内 Saitama (JP).
- (74) 代理人: 鈴木 俊一郎 (SUZUKI, Shunichiro); 〒1410031 東京都品川区西五反田七丁目13番6号五反田山 崎ビル6階 鈴木国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,

/続葉有/



な異方導電性コネクターおよび検査効率が良好な回路装置の検査方法を提供する。異方導電性コネクターの表面に潤

LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,

IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。